

Interaktive Schulungs-CD Topographie

Fachautoren:

Dr. Patrick Schwaller, Empa
Stéphane Rollier, vm. Empa

Preis inkl. MwSt:

CHF95.-

ISBN:

3-905594-41-2

Verlag und Vertrieb:

EMPA-Akademie
empa-akademie@empa.ch
www.empa-akademie.ch

Thematik und Lernziel

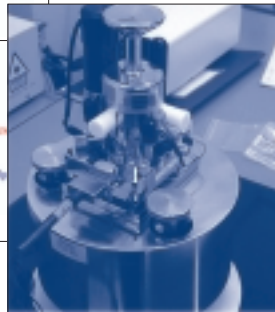
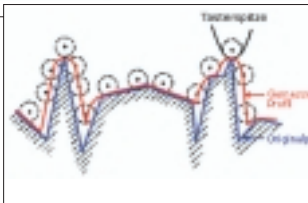
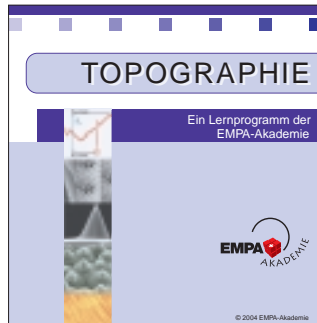
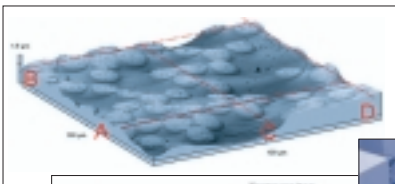
Die Oberflächentopographie eines Materials hat einen wesentlich Einfluss auf dessen Eigenschaften in Kontakt mit anderen Oberflächen. Das Lernprogramm zeigt anhand von Beispielen den Einfluss der Topographie auf die Funktion eines Materials und behandelt verschiedene Rauigkeitsparameter zur quantitativen Beschreibung der Oberflächentopographie. Den Studierenden wird zudem eine Einführung in die Messprinzipien von gängigen Topographiemessgeräten gegeben.

Inhalte

- Was ist Topographie?, z.B.
 - Bedeutung des Begriffs Topographie
 - Beispiele für Längenskalen
 - Darstellungsmöglichkeiten
- Rauigkeitsparameter, z.B.
 - Notwendigkeit von Rauigkeitsparametern
 - Wichtige Rauigkeitsparameter
 - Wahl des geeigneten Parameters
- Topographiemessverfahren, z.B.
 - Mechanische Taster
 - Laser-Profilometer
 - Raster-Kraft-Mikroskope
 - Störfaktoren

Lernkonzept

Die vorliegende CD kann zur Vor- und Nachbearbeitung von Präsenzkursen genutzt werden. Sie dient zum Aktivieren des Vorwissens und bietet den Studierenden die Möglichkeit, den Wissensstand bezüglich Oberflächentopographie und deren Messung im Hinblick auf einen Präsenzkurs anzugleichen.



Bitte
frankieren